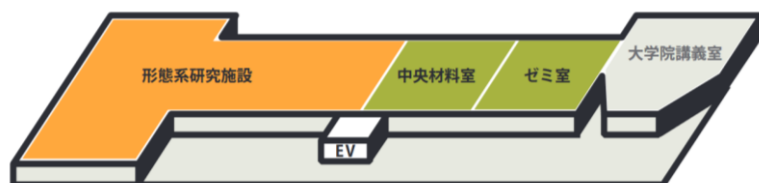


生体組織や歯科材料等の微細構造を調べるための解析機器と、それらの試料作製装置を設置している。主な設置機器としては、透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、マイクロフォーカスX線CT、HSオールインワン蛍光顕微鏡などの精密解析機器をはじめ、試料作製のマイクロトーム、臨界点乾燥装置、凍結乾燥装置、イオンスパッタ、真空蒸着装置等を配備している。走査型光電子分光分析装置PHI X-tool (アルバックファイ) は、2013年度、文部科学省研究設備整備費補助金を得て設置した。



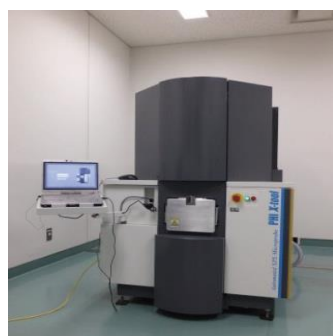
マイクロフォーカスX線CT SKYSCAN1275

試料に対してX線撮影を360°全方向からおこなう装置。得られた画像をコンピュータ処理することで、物体の内部および外部を3次元データで表現することができる。



電界放射型走査電子顕微鏡S-4800 (HITACHI)

高分解能FE-SEM で、低加速電圧で高分解能の観察ができる。チャージアップやエッジ効果を抑制するSuper ExB を搭載している。



走査型光電子分光分析装置PHI X-tool (アルバックファイ)

表面の深さ～ 10nm から放出される光電子スペクトルを測定し、表面組成や化学結合状態など、表面化学分析の情報が得られる。